# 表面码

#### 表面码

表面码的基本组成 测量比特 注释:镇定测量

**3022-11-11** 

### 表面码的基本组成

- 比特阵列
- 数据比特(data qubits)和测量比特(measurement qubits)
- 基本操作:单比特转动操作,近邻间的 CNOT, $\hat{Z}$  基底上的测量,数据比特和测量比特间的 SWAP (以便实现拓扑版本的 H 门)

#### 测量比特

每个测量比特与四个近邻的数据比特耦合,测量比特分为两种:

- 1. measure-Z 比特,也称 Z syndrome 比特,测量会使四个耦合的数据比特进入  $\hat{Z}_a\hat{Z}_b\hat{Z}_c\hat{Z}_d$  的本征态,即测量了该  $\hat{Z}$  型的镇定子
- 2. measure-X 比特,也称 X syndrome 比特,测量会使四个耦合的数据比特进入  $\hat{X}_a\hat{X}_b\hat{X}_c\hat{X}_d$  的本征态,即测量了该  $\hat{X}$  型的镇定子

[20]

每个数据比特与两个近邻的 measure-Z 比特、两个近邻的 measure-X 比特耦合。

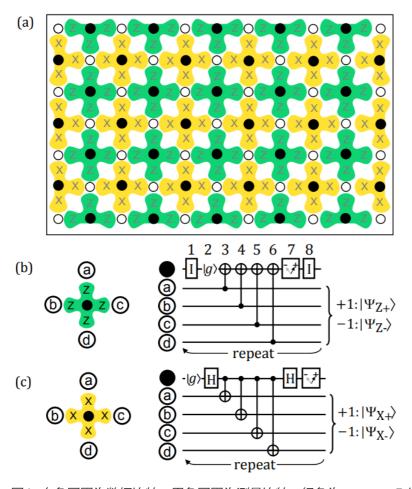


图 1. 白色圆圈为数据比特,黑色圆圈为测量比特。绿色为 measure-Z 比特,黄色为 measure-X 比特。

## 注释:镇定测量

对于一个 measure-Z 比特,其测量结果为 +1 (基态) 和 -1 (激发态) ,暗示了其近邻耦合的四个数据比特 a,b,c,d 进入了某些特定的状态

а	b	С	d	measure-Z 输出
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

注:表中0 和1 对应基态 $|g\rangle$  和激发态 $|e\rangle$ ,本征值分别为+1 和-1

例如当 measure-Z 比特测量结果为 +1,就表明 a,b,c,d 处于下面的叠加态:

$$|\Psi_{Z+}
angle = \sum_{a+b+c+d=even} A_{abcd} |abcd
angle$$

反之,当 measure-Z 比特测量结果为 -1,就表明 a,b,c,d 处于下面的叠加态:

$$|\Psi_{Z+}
angle = \sum_{a+b+c+d=odd} A_{abcd} |abcd
angle$$

对于 measure-X 比特,在 $\hat{X}$ 基底上有上述规律。